

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет

ОПШТИ ПОДАЦИ

Име и презиме*	Снежана (Миодраг) Ђорић-Вељковић
Датум и место рођења*	10.11.1963., Ниш, Република Србија
Контакт телефон*	+381 18 588200
E-mail*	snezana.djoric.veljkovic@gaf.ni.ac.rs



ПОДАЦИ О СТЕЧЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ

На Филозофском факултету у Нишу, на Наставно-научној групи Физика дипломирала 1988. године са дипломским радом под називом "Нека питања динамике флуида са несиметричним тензором напона". Магистрала 1994. године на Катедри за микроелектронику на Електронском факултету у Нишу, где је одбрањена магистарска теза под насловом: "Ефекти гама зрачења код VDMOS транзистора снаге". Докторска дисертацију под насловом "Утицај тестова поузданости на ефекте зрачења код VDMOS транзистора снаге" одбрањена је марта 2006. године, такође на Електронском факултету у Нишу.

РАДНА БИОГРАФИЈА

2000. – сада - Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет, Александра Медведева 14, Ниш, Србија

1990. – 2000. - Универзитет у Нишу, Технолошки факултет, Булевар ослобођења 124, Лесковац, Србија

1989. – 1990. - Институту за квалитет радне и животне средине "1. мај" у Нишу, Књегине Љубице 1, Ниш, Србија

Учесће на националним пројектима

2011. – сада - *Карактеризација, анализа и моделовање физичких појава у танким слојевима за примену у MOS наноконпонентама* (Пројекат основних истраживања финансиран од стране Министарства просвете и науке, односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије) (ОИ171026)

2006.-2010. г - *Физика, моделовање и карактеризација појава у танким слојевима код MOS наноконпонента* (Пројекат основних истраживања финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије) (ОИ141048)

2001.-2005. г. - *Физика, моделовање и карактеризација диелектричних слојева за MOS наноконпоненте* (Пројекат основних истраживања финансиран од стране Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије) (102169)

1995.-2000. г. - *Микроелектроника, оптоелектроника и микросистемске технологије*, потпројекат *MOS интегрисана кола и компоненте снаге* (Пројекат основних истраживања финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије)

1991.-1994. г. - *Развој технологија CMOS и VDMOS компонента снаге* (Пројекат основних истраживања финансиран од стране Министарства за науку и технологију Републике Србије)

Учешће на међународним пројектима

2020. – 2022. г. - *Reliability and radiation hardness of Metal/Oxide/High-k/Oxide/Si (MOHOS) structures with various tunneling oxides and laminated and mixed trapping layers* (реализатори: САНУ, Катедра за микроелектронику Електронског факултета у Нишу и Институт за физику чврстог стања Бугарске академије наука у Софији)

2017. – 2019. г. - *Reliability aspects of (irradiated) non-volatile multilayer structures based on high-k Hf* (реализатори: САНУ, Катедра за микроелектронику Електронског факултета у Нишу и Институт за физику чврстог стања Бугарске академије наука у Софији)

2017.-2019. г. - *Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries*, Project number: 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP, финансиран од Европске Комисије

2012. – 2016. г. - *Dynamic aspects of electrical breakdown of memory capacitors based on high-k Hf- and Al- doped Ta₂O₅* (реализатори: САНУ, Катедра за микроелектронику Електронског факултета у Нишу и Институт за физику чврстог стања Бугарске академије наука у Софији)

2010.-2011. г. - *Master Studies Development Program - MSDP* in the frame of "Master Program in Civil Engineering – Water Resources Engineering", financed by Austrian Development Cooperation; World University Service – Austrian Committee (WUS AUSTRIA)

2005. – 2007. г. - *High-k Stack Capacitors for nanoscale Dynamic Random Acces Memories (DRAMs)* (реализатори: САНУ, Катедра за микроелектронику Електронског факултета у Нишу и Институт за физику чврстог стања Бугарске академије наука у Софији)

2003.-2004. г. - *Energy efficiency in housing sector in South Eastern Europe as head point in education of architects and engineers* (реализатори: Technische Fachhochschule Berlin, Faculty of Architecture Skopje, Faculty of Civil Engineering and Architecture, DAAD)

КАТЕДРА

Катедра за математику, физику и информатику

ИЗБОРИ У ЗВАЊА

СНЕЖАНА (МИОДРАГ) ЂОРИЋ-ВЕЉКОВИЋ

УЖА НАУЧНА ОБЛАСТ: ПРИМЕЊЕНА ФИЗИКА

Звање	Установа	Датум избора у звање
Редовни професор	Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет	06.02.2017.
Ванредни професор	Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет	26.12.2011.
Доцент	Универзитет у Нишу, Грађевинско-архитектонски факултет	06.03.2006.

СПИСАК РЕФЕРЕНЦИ

СНЕЖАНА (МИОДРАГ) ЂОРИЋ-ВЕЉКОВИЋ

P. бр.	Аутор-и, наслов, часопис, година, број волумена, странице	Категорија
1.	N. Stojadinović, I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, A. Prijić, S. Golubović, and, Z. Prijić, "Negative Bias Temperature Instability in Thick Gate Oxides for Power MOS Transistors" in <i>Bias Temperature Instability for Devices and Circuits</i> , edited by Tibor Grasser, Springer Science+Business Media New York, pp. 533-559 (2014) ISBN: 978-1-4614-7908-6 (Print) 978-1-4614-7909-3 (e-book) DOI: 10.1007/978-1-4614-7909-3	M13
2.	D. Danković, I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Implications of Negative Bias Temperature Instability in Power MOS Transistors" in <i>Micro Electronic and Mechanical Systems</i> , edited by Kenichi Takahata, IN-TECH Press, Boca Raton, pp. 19.319 - 19.342 (2009) ISBN: 978-953-307-027-8	M13
3.	Adrijana Pavlović, Snežana Đorić-Veljković , Jugoslav Karamarković, " <u>The importance of ethylene-tetrafluoroethylene for building daylighting</u> ", <i>Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering</i> , vol. 16, no. 3, pp. 355-374 (2018) ISSN: 0354-4605 DOI: 10.2298/FUACE171129014P	M24
4.	V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, S. Djorić-Veljković , I. Manić, Z. Prijić, A. Prijić, N. Stojadinović, S. Stanković, " <u>NBT stress and radiation related degradation and underlying mechanisms in power VDMOSFETs</u> ", <i>Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics</i> , vol. 31, no. 3, pp. 367-388 (2018) ISSN: 0353-3670 DOI: 10.2298/FUEE1803367D (invited paper)	M24
5.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović, S. Stanković, A. Prijić, Z. Prijić, I. Manić, D. Danković, " <u>NBTI and irradiation related degradation mechanisms in power VDMOS transistors</u> ", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 88-90, pp. 135-141 (2018) ISSN: 0026-2714, DOI: 10.1016/j.microrel.2018.07.138 (invited paper)	M22
6.	Natalija Janošević, Snežana Đorić-Veljković , Gordana Topličić-Čurčić, Jugoslav Karamarković, " <u>Properties of geopolymers</u> ", <i>Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering</i> , vol. 16, pp. 045-056 (2018) ISSN: 0354-4605 DOI: 10.2298/FUACE161226004J	M24
7.	V. Davidović, D. Danković, A. Ilić, I. Manić, S. Golubović, S. Djorić-Veljković , Z. Prijić, A. Prijić, and N. Stojadinović, "Effects of consecutive irradiation and bias temperature stress in p-channel power vertical double-diffused metal oxide semiconductor transistors", <i>Japanese Journal of Applied Physics</i> , vol. 57, no. 4, article number. 044101-1-10 (2018) ISSN: 0021-4922 DOI: 10.7567/JJAP.57.044101	M23
8.	D. Danković, I. Manić, A. Prijić, V. Davidović, Z. Prijić, S. Golubović, S. Djorić-Veljković , A. Paskaleva, D. Spassov, N. Stojadinović, "A review of pulsed NBTI in P-channel power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 82, March, pp. 28 - 36 (2018) (review paper) ISSN: 0026-2714 DOI: 10.1016/j.microrel.2018.01.003	M22
9.	Sofija M. Rančić, Snežana D. Nikolić-Mandić, Aleksandar Lj. Bojić, Snežana M. Đorić-Veljković , Aleksandra R. Zarubica, Predrag Lj. Janković, "Application of the reaction system methylene blue B-(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ for the kinetic spectrophotometric determination of palladium in citric buffer media", <i>Hemijaska industrija</i> , vol. 71, issue: 2, pp. 97-104 (2017) ISSN: 0367-598X DOI: 10.2298/HEMIND140821080R	M23
10.	Marija Stojanović Krsaić, Ana Mančić, Slavica Kuzmanović, Snežana Đorić Veljković , Milutin Stepić, "Linear and interface defects in composite linear photonic lattice", <i>Optics Communications</i> , vol. 394, no. 1, pp. 6-13 (2017) ISSN: 0030-4018 DOI: 10.1016/j.optcom.2017.02.021	M22
11.	V. Davidović, D. Danković, A. Ilić, I. Manić, S. Golubović, S. Djorić-Veljković , Z. Prijić, N. Stojadinović, "NBTI and Irradiation Effects in P-Channel Power VDMOS Transistors", <i>IEEE Transactions on Nuclear Science</i> , vol. 63, no. 2, pp. 1268-1275 (2016) ISSN: 0018-9499 DOI: 10.1109/TNS.2016.2533866	M21
12.	I. Manić, D. Danković, V. Davidović, A. Prijić, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, Z. Prijić, N. Stojadinović, " <u>Effects of Pulsed Negative Bias Temperature Stressing in P-Channel Power VDMOSFETs</u> ", <i>Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics</i> , vol. 29, no. 1, pp. 49-60 (2016) (invited paper) ISSN: 0353-3670 DOI: 10.2298/FUEE1601049M	M24
13.	D. Danković, N. Stojadinović, Z. Prijić, I. Manić, V. Davidović, A. Prijić, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, "Analysis of Recoverable and Permanent Components of Threshold Voltage Shift in NBT Stressed P-Channel Power VDMOSFET", <i>Chinese Physics B</i> , vol. 24, no. 10, pp. 106601-1-9 (2015) ISSN: 1674-1056 DOI: 10.1088/1674-1056/24/10/106601	M22
14.	D. Danković, I. Manić, A. Prijić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, N. Stojadinović, Z. Prijić, S. Golubović, "Negative Bias Temperature Instability in P-Channel Power VDMOSFETs: Recoverable Versus Permanent Degradation", <i>Semiconductor Science and Technology</i> , vol. 30, pp.105009-1-9 (2015) ISSN: 0268-1242 DOI: 10.1088/0268-1242/30/10/105009	M21
15.	S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Annealing Influence on Recovery of Electrically Stressed Power Vertical Double-Diffused Metal Oxide Semiconductor Transistors", <i>Japanese Journal of Applied Physics</i> , vol. 54, no. 6, article number. 064101-1-7 (2015) ISSN: 0021-4922 DOI: 10.7567/JJAP.54.064101	M23
16.	A. Jovanović, P. Pejić, S. Djorić-Veljković , J. Karamarković, M. Djelić, "Importance of building orientation in determining daylighting quality in student dorm rooms: Physical and simulated daylighting parameters' values compared to subjective survey results", <i>Energy and Buildings</i> , vol. 77, pp. 158-170 (2014) ISSN: 0378-7788 DOI: 10.1016/j.enbuild.2014.03.048	M21a
17.	S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Comparison of Gamma-Radiation and Electrical Stress Influences on Oxide and Interface Defects in Power VDMOSFETs", <i>Nuclear Technology & Radiation Protection</i> , vol. 28, no. 4, pp. 406-414 (2013) ISSN: 1451-3994 DOI: 10.2298/NTRP1304406D	M22

18.	D. Danković, I. Manić, A. Prijić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, Z. Prijić, and N. Stojadinović, "Effects of Static and Pulsed Negative Bias Temperature Stressing on Lifetime in p-Channel Power VDMOSFETs", <i>Informacije MIDEM-Journal of Microelectronics Electric Components and Materials</i> , vol. 43, iss. 1, pp. 58-66 (2013) ISSN: 0352-9045	M23
19.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, A. Prijić, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, Z. Prijić, N. Stojadinović, "Lifetime Estimation in NBT-Stressed P-Channel Power VDMOSFETs", <i>Facta Universitatis: Series Automatic Control and Robotics</i> , vol. 11, no. 1, pp. 15-23 (2012) ISSN: 1820-6417 UDC 621.3.049.77 621.3.019.3 621.382.323	M24
20.	I. Manić, D. Danković, A. Prijić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, Z. Prijić, and N. Stojadinović, " NBTI Related Degradation and Lifetime Estimation in p-Channel Power VDMOSFETs Under the Static and Pulsed NBT Stress Conditions ", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 51, no. 9-11, pp. 1540 - 1543 (2011) ISSN: 0026-2714 DOI: 10.1016/j.microrel.2011.06.004	M22
21.	S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Annealing of Radiation-Induced Defects in Burn-in Stressed Power VDMOSFETs", <i>Nuclear Technology & Radiation Protection</i> , vol. 26, no. 1, pp. 18-24 (2011)	M23
22.	N. Stojadinović, D. Danković, I. Manić, A. Prijić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, Z. Prijić, "Threshold Voltage Instabilities in p-Channel Power VDMOSFETs Under Pulsed NBT Stress", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 50, pp. 1278-1282 (2010)	M22
23.	I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Effects of Low Gate Bias Annealing in NBT Stressed p-Channel Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 49, pp. 1003 - 1007 (2009)	M22
24.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, and N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instability in n-Channel Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 48, pp. 1313 - 1317 (2008)	M22
25.	V. Davidović, N. Stojadinović, D. Danković, S. Golubović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , and S. Dimitrijević, "Turn-Around of Threshold Voltage in Gate Bias Stressed p-Channel Power Vertical Double-Diffused Metal-Oxide-Semiconductor Transistors", <i>Japanese J. Appl. Phys.</i> , vol. 47, pp. 6272-6276 (2008)	M22
26.	I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, "Mechanisms of Spontaneous Recovery in DC Gate Bias Stressed Power VDMOSFETs", <i>IEE Proc. - Circuits, Devices and Systems</i> , vol. 2, pp. 213-221 (2008)	M23
27.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instabilities in Sequentially Stressed and Annealed in p-Channel Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 47, pp. 1400 - 1405 (2007)	M22
28.	D. Danković, I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, "NBT Stress-Induced Degradation and Lifetime Estimation in p-channel Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 46, pp. 1828 - 1833 (2006)	M22
29.	N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković , S. Golubović and S. Dimitrijević, "Electrical stressing effects in commercial power VDMOSFETs", <i>IEE Proc.- Circuits, Devices and Systems</i> , vol. 153, pp. 281-288 (2006)	M22
30.	N. Stojadinović, D. Danković, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, I. Manić, S. Golubović, "Negative bias temperature instability mechanisms in p-channel power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 45, pp. 1343-1348 (2005)	M23
31.	N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljković , S. Golubović and S. Dimitrijević, "Effects of Electrical Stressing in Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 45, pp. 115-122 (2005) (invited paper)	M22
32.	S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović, S. Golubović and N. Stojadinović, "Effects of burn-in stressing on post-irradiation annealing response of power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 43, pp. 1455-1460 (2003)	M22
33.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, D. Danković, S. Golubović and S. Dimitrijević, "Mechanisms of spontaneous recovery in positive gate bias stressed power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 42, pp. 1465-1468 (2002)	M22
34.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović, and S. Golubović, "Effects of burn-in stressing on radiation response of power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Journal</i> , vol. 33, pp. 899-905 (2002)	M22
35.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović and S. Dimitrijević, "Effects of high electric field and elevated-temperature bias stressing on radiation response in power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 42, pp. 669-677 (2002)	M22
36.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović and S. Golubović, "Radiation hardening of power VDMOSFETs using electrical stress", <i>Electronics Letters</i> , vol. 38, pp. 431-431 (2002)	M21
37.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović and S. Dimitrijević, "Mechanisms of Positive Gate Bias Stress Induced Instabilities in Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics Reliability</i> , vol. 41, pp. 1373-1378 (2001)	M23
38.	S. Golubović, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, and N. Stojadinović, "Modeling of γ -irradiation and lowered temperature effects in power VDMOS transistors", <i>Japanese J. Appl. Phys.</i> , vol. 38, pp. 4699-4702 (1999), N. Stojadinović, S. Golubović, S. Djorić-Veljković, and V. Davidović, "Correction to "Modeling of γ -irradiation and lowered temperature effects in power VDMOS transistors"", <i>Japanese J. Appl. Phys.</i> , vol. 40 (3A), p. 1530 (2001)	M21
39.	N. Stojadinović, S. Golubović, V. Davidović, S. Djorić-Veljković and S. Dimitrijević, "Modeling Radiation-Induced Mobility Degradation in MOSFETs", <i>Phys. Stat. Sol. (a)</i> , vol. 169, pp. 63-66 (1998)	M22
40.	N. Stojadinović, S. Golubović, S. Djorić and S. Dimitrijević, "Analysis of Gamma-Irradiation Induced Degradation Mechanisms in Power VDMOSFETs", <i>Microelectronics and Reliability</i> , vol. 35, pp. 587-602 (1995)	M22
41.	N. Stojadinović, S. Djorić , S. Golubović and V. Davidović, "Separation of Irradiation Induced Gate Oxide Charge and Interface Traps Effects in Power VDMOSFETs", <i>Electronics Letters</i> , vol. 30, pp. 1992-1993 (1994)	M21

42.	D. Spassov, A. Paskaleva, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Stanković, N. Stojadinović, Tz. Ivanov, and T. Stanchev, "Impact of γ Radiation on Charge Trapping Properties of Nanolaminated $\text{HfO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ ALD Stacks", <i>Proc. 31th International Conference on Microelectronics (MIEL '19)</i> , Niš, September 16-18, 2019 (pp. 59-62) DOI: 10.1109/MIEL.2019.8889600, ISBN: 978-1-7281-3418-5	M33
43.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković, V. Davidović, S. Golubović, S. Stankovic, A. Prijić, Z. Prijić, I. Manić, D. Danković, " NBTI and irradiation related degradation mechanisms in power VDMOS transistors ", <i>29th European Symposium on the Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF)</i> , Aalborg, Denmark, October 01-05, 2018 (pp. 135-141) DOI: 10.1016/j.microrel.2018.07.138 (invited paper)	M31
44.	Gordana Topličić-Čurčić, Aleksandar Keković, Dušan Grdić, Snežana Đorić - Veljković , Zoran Grdić, "Phase change materials (PCMs) – Innovative materials for improvement of energy efficiency of buildings", <i>6th International conference "Contemporary achievements in civil engineering" 20. April 2018. Subotica, SERBIA, Conference Proceedings of 6th International conference "Contemporary achievements in civil engineering"</i> , Faculty of civil engineering Subotica, Subotica 2018, publisher: Faculty of civil engineering Subotica, University of Novi Sad, UDK: 66.018.4:697, DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.032, pp. 323 – 334, ISBN: 978-86-80297-73-6	M33
45.	V. Davidović, A. Paskaleva, D. Spassov, E. Guzewicz, T. Krajewski, S. Golubović, S. Djorić-Veljković , I. Manić, D. Danković, and N. Stojadinović, "Electrical and Charge Trapping Properties of $\text{HfO}_2/\text{Al}_2\text{O}_3$ Multilayer Dielectric Stacks", <i>Proc. 30th International Conference on Microelectronics (MIEL '17)</i> , Niš, October 9-11, 2017 (pp. 143-146) DOI: 10.1109/MIEL.2017.8190088, ISBN: 978-1-5386-2561-3	M33
46.	D. Danković, I. Manić, N. Stojadinović, Z. Prijić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, A. Prijić, A. Paskaleva, D. Spassov, and S. Golubović, "Modelling of Threshold Voltage Shift in Pulsed NBT Stressed P-Channel Power VDMOSFETs", <i>Proc. 30th International Conference on Microelectronics (MIEL '17)</i> , Niš, October 9-11, 2017 (pp. 147-151) DOI: 10.0.4.85/MIEL.2017.8190089, ISBN: 978-1-5386-2561-3	M33
47.	A. Jovanović, S. Djorić-Veljković , J. Karamarković, P. Pejić, "Towards determining daylighting conditions in student dormitories-a South Eastern Europe Case Study", <i>Proc. of World Sustainable Buildings Conference Barcelona, (WSB 14)</i> , Barcelona, 28-30 October 2014 (vol. 4, session 136, pp. 395-1-7) ISBN: 978-84-697-1815-5	M33
48.	S. Djorić-Veljković , V. Davidović, D. Danković, I. Manić, S. Golubović, and N. Stojadinović, "Recovery Treatment Effects on Gamma Radiation Response in Electrically Stressed Power VDMOS Transistors", <i>Proc. 29th International Conference on Microelectronics (MIEL '14)</i> , Belgrade, May 2014 (pp. 293-296) DOI: 10.1109/MIEL.2014.6842146	M33
49.	S. Djorić-Veljković , J. Karamarković, D. Randjelović, M. Vasov, H. Krstić, "Room surfaces colours and interior lightening", <i>Proc. of 2013 - "Color in all directions", Third International Color Conference for the Southeast European Countries</i> , Veliko Tarnovo, Bulgaria, 18. - 20. June 2013 (pp. 577-589) ISSN: 1313-4884	M33
50.	Dusan Randjelovic, Miomir Vasov, Jugoslav Karamarkovic, Snezana Djoric-Veljkovic , Hristina Krstic, "The influence of interior colors for efficient energy consumption", <i>Proc. of 2013 - "Color in all directions", Third International Color Conference for the Southeast European Countries</i> , Veliko Tarnovo, Bulgaria, 18.-20. June 2013 (pp. 557-567) ISSN: 1313-4884	M33
51.	S. Rančić, S. Djorić-Veljković , A. Zarubica, "Environmentally friendly colors", <i>Proc. of 2013 - "Color in all directions", Third International Color Conference for the Southeast European countries</i> , Veliko Tarnovo, Bulgaria, 18.-20. June 2013 (pp. 496-501) ISSN: 1313-4884	M33
52.	S. Đorić-Veljković , S. Rančić, P. Janković, B. Rančić, "Using Novel Systems and Installations for Introducing Daylight", <i>Proc. of 9th Scientific Technical Conference Contemporary Theory and Practice in Building Development</i> , Banja Luka, 11.-12. April 2013 (pp. 405-413) ISBN: 978-99955-630-8-0	M33
53.	S. Đorić-Veljković , J. Karamarković, "Challenges and Possibilities of Application of OLED Light Sources", <i>Proc. Innovation as a Function of Engineering Development (IDE 2011)</i> , Niš, 25-26 November 2011 (pp. 103-108) publisher: Faculty of Civil engineering and Architecture ISBN: 978-86-80295-98-5, COBISS.SR – ID 187462412	M33
54.	I. Manić, D. Danković, A. Prijić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković, S. Golubović, and Z. Prijić, N. Stojadinović, " NBTI Related Degradation and Lifetime Estimation in p-Channel Power VDMOSFETs Under the Static and Pulsed NBT Stress Conditions ", <i>Proc. 22nd European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis (ESREF 2011)</i> , Bordeaux (France) 3-7 October 2011,(pp. 1540-1543), also <i>Microelectronics Reliability 2011</i> , ISSN: 0026-2714	M33
55.	I. Manić, D. Danković, S. Djorić-Veljković , A. Prijić, V. Davidović, S. Golubović, Z. Prijić, and N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Instability in p-Channel Power VDMOSFETs Under Pulsed Bias Stress", <i>Proc. 10th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2010)</i> , Prague (Czech Republic) September 2010 pp. 173-178	M33
56.	S. Djorić-Veljković , D. Danković, A. Prijić, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, Z. Prijić and N. Stojadinović, "Degradation of p-channel Power VDMOSFETs under Pulsed NBT Stress", <i>Proc. 27th International Conference on Microelectronics (MIEL 2010)</i> , Niš, May 2010 (pp. 443-446)	M33
57.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, and N. Stojadinović, "Negative Bias Temperature Stress and Annealing Effects in p-Channel Power VDMOSFETs", <i>Proc. 9th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS '08)</i> , Prague, August 2008 (pp.127-133)	M33
58.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Golubović, and N. Stojadinović, "New Approach in Estimating the Lifetime in NBT Stressed p-Channel Power VDMOSFETs", <i>Proc. 26th International Conference on Microelectronics (MIEL '08)</i> , Niš, May 2008 (pp.599-602)	M33
59.	N. Stojadinović, D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , and S. Golubović, "Impact of Negative Bias Temperature Instabilities on Lifetime in p-Channel Power MOSFETs", <i>Proc. 8th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2007)</i> , Niš (Serbia), September 2007 (pp. 275-282) (invited paper)	M31
60.	V. Davidović, N. Stojadinović, D. Danković, S. Golubović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , S. Dimitrijević, "Turn-around of threshold voltage in gate bias stressed p-channel power VDMOS transistors", <i>Proc. 9th International Seminar on Power</i>	M33

	<i>Semiconductors (ISPS 2006)</i> , Prague, September 2006 (pp.85-89)	
61.	D. Danković, I. Manić, S. Djorić-Veljčković , V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, "Lifetime estimation in NBT stressed p-channel power VDMOSFETs", <i>Proc. 25th International Conference on Microelectronics (MIEL 2006)</i> , Beograd, May 2006 (pp. 645-648)	M33
62.	I. Manić, S. Djorić-Veljčković , V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, "Spontaneous recovery in DC gate bias stressed power VDMOSFETs", <i>Proc. 25th International Conference on Microelectronics (MIEL 2006)</i> , Beograd, May 2006 (pp.639-644)	M33
63.	N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljčković , S. Golubović, S. Dimitrijević, "Electrical stressing effects in power VDMOSFETs", <i>Proc. 7th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2004)</i> , Prague, September 2004 (pp. 109-114)	M33
64.	S. Djorić-Veljčković , I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, "Burn-in stressing effects on post-irradiation annealing response of power VDMOSFETs", <i>Proc. 24th International Conference on Microelectronics (MIEL 2004)</i> , Niš, May 2004 (pp.701-704)	M33
65.	N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljčković , S. Golubović and S. Dimitrijević, "Effects of Electrical Stressing in Power VDMOSFETs", <i>Conference on Electron Devices and Solid-State Circuits (EDSSC 2003)</i> , Hong Kong (China), December 2003 (pp. 291-296)	M33
66.	V. Davidović, I. Manić, S. Djorić-Veljčković , D. Danković, S. Golubović, S. Dimitrijević and N. Stojadinović, "Effects of Negative Gate Bias Stressing in Power VDMOSFETs", <i>7th International Symposium on Microelectronics Technologies and Microsystems (MTM 2003)</i> , Sozopol (Bulgaria), September 2003 (pp.150-155)	M33
67.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljčković , I. Manić, V. Davidović and S. Golubović, "Radiation Response of Elevated-Temperature Bias Stressed Power VDMOSFETs", <i>Proc. 6th International Seminar on Power Semiconductors (ISPS 2002)</i> , Prague (Czech Republic), September 2002 (pp. 69-74)	M33
68.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljčković , I. Manić, V. Davidović and S. Golubović, "Effects of Positive Gate Bias Stress on Radiation Response in Power VDMOSFETs", <i>Proc. 23rd International Conference on Microelectronics (MIEL 2002)</i> , Niš, May 2002 (pp. 723-726)	M33
69.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljčković , V. Davidović, D. Danković, S. Golubović and S. Dimitrijević, "Spontaneous Recovery of Positive Gate Bias Stressed Power VDMOSFETs", <i>Proc. 23rd International Conference on Microelectronics (MIEL 2002)</i> , Niš, May 2002 (pp. 717-722)	M33
70.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljčković , V. Davidović, S. Golubović, and S. Dimitrijević, "Effects of Positive Gate Bias Stressing and Subsequent Recovery Treatment in Power VDMOSFETs", <i>Proc. 4th IEEE International Caracas Conference on Devices, Circuits, and Systems (ICDCS 2002)</i> , Aruba (Dutch Caribbean), 15-17 April 2002, pp. DO50-1 - DO50-8. (invited paper)	M31
71.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljčković , V. Davidović, I. Manić, and S. Golubović, "Gamma-Irradiation Effects in Power MOSFETs for Applications in Communications Satellites", <i>Proc. 5th International Conference on Telecommunications in Modern Satellite, Cable and Broadcasting Services (TELSIKS 2001)</i> , Niš, September 2001 (pp. 395-400)	M33
72.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljčković , I. Manić, V. Davidović, and S. Golubović, "Effects of Elevated-Temperature Bias Stressing on Radiation Response in Power VDMOS Transistors", <i>Proc. 8th International Symposium on the Physical & Failure Analysis of Integrated Circuits (IPFA 2001)</i> , Singapore, July 2001 (pp. 243-248)	M33
73.	I. Manić, Z. Pavlović, S. Golubović, S. Djorić-Veljčković , V. Davidović, and N. Stojadinović, "Effects of γ -Irradiation on Drain Current and Transconductance in Power VDMOS Transistors", <i>Proc. 8th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES 2001)</i> , Zakopane (Poland), June 2001 (pp. 333-338)	M33
74.	S. Djorić-Veljčković , V. Davidović, S. Golubović and N. Stojadinović, "Radiation Effects in Low-Temperature Stressed Power VDMOS Transistors", <i>Proc. 23rd International Semiconductor Conference (CAS'2000)</i> , Sinaia (Romania), October 2000 (pp. 337-340)	M33
75.	S. Djorić-Veljčković , S. Golubović, V. Davidović, and N. Stojadinović, "Power VDMOS Transistors Response to Lowered Temperature Conditions", <i>Proc. 22nd International Conference on Microelectronics (MIEL 2000)</i> , Niš, May 2000 (pp. 383-386)	M33
76.	V. Davidović, S. Djorić-Veljčković , S. Golubović and N. Stojadinović, "Room Temperature Relaxation of Irradiated and Cooled Power VDMOS Transistors", <i>Proc. 6th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits And Systems (MIXDES 1999)</i> , Krakow (Poland), June 1999 (pp. 291-294)	M33
77.	N. Stojadinović, S. Golubović, V. Davidović, S. Djorić-Veljčković and S. Dimitrijević, "Modeling of Radiation-Induced Mobility Degradation in MOSFETs", <i>Proc. 21st International Conference on Microelectronics (MIEL 1997)</i> , Niš, September 1997 (pp. 355-356)	M33
78.	S. Djorić-Veljčković and V. Davidović, "Analysis of Gamma-Irradiation Induced Oxide Charge and Interface Trap Effects in Power VDMOSFETs", <i>Proc. 20th International Conference on Microelectronics (MIEL 1995)</i> , vol. 1, Niš, September 1995 (pp. 259-262)	M33
79.	Snežana Đorić-Veljčković , Predrag Janković, Sofija Rancić, Momčilo Kocić, Marija Stojanović-Krasić, "Novel materials for optical fibers", <i>Book of abstracts 12th symposium, "Novel technologies and economic development"</i> , Leskovac, 18-19 October 2019 (s. 135)	M34
80.	M. Stojanović Krasić, A. Mančić, S. Kuzmanović, S. Đorić Veljković and M. Stepić, "Light propagation through the composite linear photonic lattice containing two nonlinear defects", <i>Proc. of 5th International School Conference on Photonics (Photonica 2015), Belgrade (Serbia), 24.-28. Avgust 2015 (pp. 70-71)</i> ISBN: 978-86-7306-131-3	M34
81.	N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Djorić-Veljčković , S. Golubović and S. Dimitrijević, "Effects of electrical stressing in power VDMOSFETs" - Invited paper, <i>1st International Conference on Electrical and Electronic Engineering (ICEEE 2004)</i> , Acapulco (Mexico), September 2004, <i>takođe u y Microelectronics Reliability (2005)</i>	M34

82.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović and S. Golubović, "Electrical Stress Effects in Thick Gate Oxides for Power MOS Devices", <i>12th International School on Condensed Matter Physics (ISCMP 2002)</i> , Varna (Bulgaria), September 2002	M34
83.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović and S. Dimitrijević, "Effects of Negative Gate Bias Stressing in Thick Gate Oxides for Power VDMOSFETs", Abstract Booklet <i>12th Workshop on Dielectrics in Microelectronics (WoDiM 2002)</i> , Grenoble (France), November 2002 (pp. 41-44)	M34
84.	S. M. Rančić, S. D. Nikolić-Mandić, A. Lj. Bojić, S. M. Đorić-Veljković , A. R. Zarubica, P. Lj. Janković, "Primena reakcionog sistema alizarin-H ₂ O ₂ u boratnom puferu za spektrofotometrijsko kinetičko određivanje nikla", <i>Advanced technologies</i> , vol. 4, no. 2, pp. 60-64 (2015) doi:10.5937/savteh1502060R UDK: 546.742:543.48	M52
85.	M. Petrović, S. Đorić-Veljković , J. Karamarković, "Zaštita životne sredine u građevinarstvu sa osvrtom na primenu ekoloških i nano materijala", <i>Vojno tehnički glasnik/Military Technical Courier</i> , vol. 63, no. 2, pp. 179-194 (2015) DOI: 10.5937/vojtehg63-6478, ISSN: 0042-8469, e-ISSN: 2217-4753	M52
86.	Snežana Đorić-Veljković , Sofija Rančić, Predrag Janković, "Primena optičkih vlakana za uvođenje svetlosti u objekte", <i>Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta</i> , br. 28, str. 185-194 (2013) ISSN: 1452-2845 UDK: 666.189.21:666.22:628.9	M52
87.	M. Petrović, S. Đorić-Veljković , J. Karamarković, "Puasonov potok događaja kao model za prolazak vozila kroz presek puta", <i>Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, Niš</i> , str.181-188 (2010), ISSN: 1452-2845	M52
88.	Snežana Đorić-Veljković , Vojkan Davidović, Danijel Danković, Snežana Golubović and Ninoslav Stojadinović, "Procedure merenja električnih karakteristika napreznih p-kanalnih VDMOS tranzistora snage", Zbornik radova 63. konferencije za ETRAN, Srebrno jezero, 03-06 jun 2019, str. 601-604.	M63
89.	Vojkan Davidović, Danijel Danković, Snežana Golubović, Snežana Đorić-Veljković , Ivica Manić, Zoran Prijić, Aneta Prijić, Ninoslav Stojadinović, "Elektrohemijski procesi kod p-kanalnih VDMOS tranzistora snage pri sukcesivnom NBT napreznju i ozračivanju", Zbornik radova 62. konferencije za ETRAN, Palić, 11-14 jun 2018, str. 299-303.	M63
90.	Vojkan Davidović, Albena Paskaleva, Dencho Spassov, Ezbieta Guziewicz, Tomasz Krajewski, Snežana Golubović, Snežana Đorić-Veljković , Ivica Manić, Danijel Danković, Ninoslav Stojadinović, "Ispitivanje višeslojnih HfO ₂ /Al ₂ O ₃ struktura za memorijske komponente", Zbornik 61. Konferencije za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku, ETRAN 2017, MO1.1.1-MO1.1.4, Kladovo, 05.-08. jun 2017. (nagrađen rad)	M63
91.	S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, "Uticaj odžarivanja na oporavak električno napreznih VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova LVII konferencije za ETRAN</i> , Zlatibor, 3-6. jun 2013 (str. MO1.2-1-6) (nagrađen rad)	M63
92.	S. Djorić-Veljković , S. Rančić, "Innovative Systems and Installation for Providing of Light Into the Buildings", <i>Zbornik radova III Naučno-stručnog simpozijuma Instalacije & arhitektura I&A, Beograd</i> , 8. novembar 2012 (str. 183-189) ISBN: 978-86-7924-086-6 Izdavač: Arhitektonski Fakultet Univerzitet u Beogradu	M63
93.	D. Danković, A. Prijić, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, Z. Prijić, N. Stojadinović, S. Đorić-Veljković , "Određivanje perioda pouzdanog rada p-kanalnih VDMOS tranzistora snage podvrgnutih kontinualnim i impulsnim NBT napreznjima", <i>Zbornik radova LVI konferencije za ETRAN</i> , Zlatibor, 11-14 Jun 2012 (str. MO1.1-1- MO1.1-4)	M63
94.	M. Petrović, S. Đorić-Veljković , J. Karamarković, "Puasonov potok događaja kao model za prolazak vozila kroz presek puta", Saopšten na Konferenciji Sinergija Arhitekture i građevinarstva, Novembar 2010, Niš, Takođe, <i>Zbornik radova Građevinsko-arhitektonskog fakulteta, Niš</i> , str. 181-188 (2010)	M63
95.	Snežana Đorić-Veljković , "Priroda i svojstva elektromagnetnog zračenja i termografija", <i>Zbornik radova I Naučno-stručnog simpozijuma Instalacije & arhitektura I&A, Beograd</i> , 28-29. oktobar 2010 (str. 273-282)	M63
96.	D. Danković, A. Prijić, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, Z. Prijić, S. Djorić-Veljković , "Instabilities in p-Channel Power VDMOSFETs Subjected to Pulsed Negative Bias Temperature Stressing", <i>Zbornik radova LIV konferencije za ETRAN, Donji Milanovac</i> , 7-10. jun 2010 (str. MO1.1-1-4)	M63
97.	Đ. Kostadinović, D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , "Efekti spontanog oporavka kod p-kanalnih VDMOS tranzistora snage napreznih jakim električnim poljem u oksidu gejta", <i>Zbornik radova LIII konferencije za ETRAN, Vrnjačka Banja</i> , 15-18 jun 2009 (str. MO1.2-1-4)	M63
98.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , "Instabilities in p-channel power VDMOSFETs Subjected to Multiple Negative Bias Temperature Stressing and Annealing", <i>Zbornik radova LIII konferencije za ETRAN, Vrnjačka Banja</i> , 08-12 jun 2009 (str. MO1.1-1-4)	M63
99.	S. Djorić-Veljković , V. Davidović, S. Golubović, "Efekti NBT napreznja i odžarivanja kod P-kanalnog VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova LII konferencije za ETRAN, Palić</i> , 08-12 jun 2008 (str. MO1.3-1-4)	M63
100.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , "Life Time Evaluation in p-channel Power VDMOSFETs Under NBT Stress", <i>Zbornik radova LII konferencije za ETRAN, Palić</i> , 08-12 jun 2008 (str. MO1.2-1-4) (nagrađen rad)	M63
101.	D. Danković, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , "Nestabilnosti p-kanalnog VDMOS tranzistora snage usled naponsko-temperaturnih napreznja sa negativnom polarizacijom gejta", <i>Zbornik radova XLIX jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Budva, jun 2005, sveska IV (str. 129-132) (nagrađen rad)	M63
102.	V. Davidović, N. Stojadinović, D. Danković, S. Golubović, I. Manić, S. Djorić-Veljković , S. Dimitrijević, "Turn-around efekat napona praga kod PMOS tranzistora napreznih pozitivnim naponima na gejtu", <i>Zbornik radova XLIX jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Budva, jun 2005, sveska IV (str. 125-128)	M63
103.	S. Djorić-Veljković , N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, "Uticaj temperaturno-naponskih testova pouzdanosti na efekte odžarivanja kod ozračenih VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XLVII jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Herceg Novi, jun 2003, sveska IV (str. 187-190)	M63

104.	I. Manić, V. Davidović, D. Danković, S. Golubović, N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , S. Dimitrijević, "Efekti naprežanja negativnom polarizacijom na gejtu kod VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XLVII jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Herceg Novi, jun 2003, sveska IV (str. 183-186)	M63
105.	V. Davidović, S. Golubović, I. Manić, D. Danković, N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , S. Dimitrijević, "Primena tehnika za razdvajanje efekata naelektrisanja u oksidu i površinskih stanja kod VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XLVI jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Banja Vrućica (Republika Srpska), jun 2002, sveska IV (str. 145-148)	M63
106.	N. Stojadinović, S. Djorić-Veljković , I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, "Uticaj električnog naprežanja na otpornost VDMOS tranzistora snage na zračenje", <i>Zbornik radova XLVI jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Banja Vrućica (Republika Srpska), jun 2002, sveska IV (str. 142-144)	M63
107.	N. Stojadinović, I. Manić, S. Golubović, V. Davidović, S. Djorić-Veljković , S. Dimitrijević, "Efekti naprežanja pozitivnom polarizacijom na gejtu kod VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XLV jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Bukovička Banja, jun 2001, sveska IV (str. 204-207)	M63
108.	S. Djorić-Veljković , N. Stojadinović, I. Manić, V. Davidović, S. Golubović, "Uticaj temperaturno- naponskih testova pouzdanosti na efekte zračenja kod VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XLV jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Bukovička Banja, jun 2001, sveska IV (str. 200-203)	M63
109.	S. Djorić-Veljković , S. Golubović, V. Davidović and N. Stojadinović, "Efekti niskih temperatura kod VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XLIV jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Soko Banja, jun 2000, sveska IV (str. 185-188)	M63
110.	S. Djorić-Veljković , S. Golubović, V. Davidović i N. Stojadinović, "Uticaj različitih naprežanja na formiranje latentnih defekata tokom spontanog oporavka VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XLIII jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Zlatibor, septembar 1999, sveska IV (str. 139-141)	M63
111.	M. Kocić, S. Djorić-Veljković , Z. Veljković, S. Stojiljković i D. Stojiljković, "Neki aspekti tehnologije optičkih vlakana", <i>Zbornik radova II simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 1996 (str. 58-59)	M63
112.	S. Djorić-Veljković , Z. Veljković, M. Kocić, D. Vučić, "Pitanje odlaganja i mogućnosti uništavanja radioaktivnog otpada", <i>Zbornik radova II simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 1996 (str. 60-63)	M63
113.	S. Djorić-Veljković i V. Davidović, "Analiza efekata gama zračenjem indukovanih naelektrisanja u oksidu i površinskih stanja kod VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova XXXIX jugoslovenske konferencije za ETRAN</i> , Zlatibor, jun 1995 (str. 139-142)	M63
114.	D. Vučić, M. Kocić, D. Stojiljković, S. Djorić , S. Žerajić, "Mojre metoda izračunavanja elastične deformacije savijanja kružne ploče", <i>Zbornik radova I simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 1995 (str. 69-73)	M63
115.	S. Djorić , M. Kocić, D. Vučić, "Fraunhoferova difrakcija svetlosti na pukotini koja je pokrivena sa dva fazna sloja", <i>Zbornik radova I simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 1995 (str. 11-16)	M63
116.	S. Dimitrijević, S. Djorić , S. Golubović and N. Stojadinović, "Analysis of Gamma-Irradiation Induced Degradation Mechanisms in Power MOSFETs: Creation of Gate Oxide Charge and Interface Traps", <i>Proc. 2nd Serbian Conference on Microelectronics and Optoelectronics (MIOPEL 93)</i> , Niš, October 1993 (pp. 73-79) (nagrađen rad)	M63
117.	N. Stojadinović, S. Djorić , S. Golubović and S. Dimitrijević, "Analysis of Gamma-Irradiation Induced Degradation Mechanisms in Power MOSFETs: Changes in Gate Oxide Charge and Interface Traps", <i>Proc. 2nd Serbian Conference on Microelectronics and Optoelectronics (MIOPEL 93)</i> , Niš, October 1993 (pp. 67-72)	M63
118.	S. Golubović, G. Ristić, S. Djorić i N. Stojadinović, "Efekti gama-zračenja kod VDMOS tranzistora snage", <i>Zbornik radova I Srpske konferencije o mikro i optoelektronici (MIOPEL 92)</i> , Beograd, 1992 (str. 1-3)	M63
119.	Predrag Janković, Snežana Đorić-Veljković , Sofija Rančić, "Problem of water quality in water jet cutting machines", <i>Book of abstracts 12th symposium, "Novel technologies and economic development"</i> , Leskovac, 20-21 October 2017 (s. 133) ISBN 978-86-89429-22-0	M64
120.	Gordana Topličić-Čurčić, Snežana Đorić-Veljković , Jugoslav Karamarković, "Phase change materials in green building", <i>Book of abstracts 12th symposium, "Novel technologies and economic development"</i> , Leskovac, 20-21 October 2017 (s. 150) ISBN 978-86-89429-22-0	M64
121.	Marija Stojanović-Krasić, Slavica Jovanović, Ana Mančić, Snežana Đorić-Veljković , "Light propagation through the system of two nonlinear one-dimensional structurally different photonic lattices", <i>Book of abstracts 12th symposium, "Novel technologies and economic development"</i> , Leskovac, 20-21 October 2017 (s. 171) ISBN 978-86-89429-22-0	M64
122.	S. Rančić, S. Nikolić-Mandić, A. Bojić S. Đorić-Veljković , A. Zarubica, P. Janković, "Određivanje Ni(II) u rastvoru", <i>Zbornik izvoda radova XI simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, 23-24 oktobar 2015 (s. 157) ISBN: 978-86-89429-12-1	M64
123.	S. Đorić-Veljković , S. Rančić, P. Janković, M. Kocić, M. Stojanović-Krasić, Lj. Antić, "Transmission of the visible region of electromagnetic radiation spectrum through optical fibers", <i>Zbornik izvoda radova XI simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, 23-24 oktobar 2015 (s. 156) ISBN: 978-86-89429-12-1	M64
124.	S. Đorić-Veljković , M. Kocić, D. Randelović, Lj. Antić, "Optička vlakna kao medijum za prenošenje dnevne svetlosti", <i>Zbornik izvoda radova X simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, 22-23 oktobar 2013 (s. 160) ISBN: 978-86-82367-98-7	M64
125.	S. Rančić, S. Nikolić-Mandić, A. Bojić S. Đorić-Veljković , "Određivanje Co(II) u rastvoru", <i>Zbornik izvoda radova X simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, 22-23 oktobar 2013 (s. 175) ISBN: 978-86-82367-98-7	M64
126.	S. Rančić, S. Đorić-Veljković , P. Janković, "Primena polimetilmetakrilata u proizvodnji optičkih vlakana za specifične namene", <i>Zbornik izvoda radova X simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, 22-23 oktobar 2013 (s. 128) ISBN: 978-86-82367-98-7	M64

127.	S. Zdravković, S. Djorić-Veljković i M. Kocić, "Interakcija jonizujućeg zračenja sa materijom", <i>Zbornik izvoda radova IX simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, 21-22 oktobar 2011 (s. 157) ISBN: 978-86-82367-92-5 Издавач: Технолошки факултет у Лесковцу	M64
128.	S. Djorić-Veljković i M. Kocić, "Elementi slabljenja talasa u svetlovodima", <i>Zbornik izvoda radova VIII simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 2009 (s. 169)	M64
129.	S. Djorić-Veljković i M. Kocić, "Neki elementi tehnologije optičkih vlakana", <i>Zbornik izvoda radova VII simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 2007 (s. 157)	M64
130.	S. Djorić-Veljković i M. Kocić, "Neki aspekti slabljenja talasa u svetlovodima", <i>Zbornik izvoda radova VI simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 2005 (s. 146)	M64
131.	M. Kocić, S. Djorić-Veljković i D. Vučić, "Neke karakteristike slabljenja talasa u svetlovodima", <i>Zbornik izvoda radova V simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 2003 (s. 126)	M64
132.	M. Kocić, D. Vučić i S. Djorić-Veljković , "Primena Freinelovih integrala kod rešenja problema difrakcije svetlosti konstantne amplitude na uskom prorezu", <i>Zbornik izvoda radova V simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 2003 (str. 124-125)	M64
133.	S. Djorić-Veljković , M. Kocić, D. Stojiljković i N. Cakić, "Elementi razvoja tehnologije optičkih vlakana i optičkih kablova", <i>Zbornik izvoda radova IV simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 2001 (s. 151)	M64
134.	D. Stojiljković, M. Kocić and S. Djorić-Veljković , "Application of the system of differential equations to modelling the breaking of the yarns", XIII Conference on Applied Mathematics PRIM'98 Abstracts, <i>Igalo, May 1998</i> (p. 42)	M64
135.	D. Vučić, M. Kocić i S. Djorić-Veljković , "Standardizacija nivoa bezbednosti u sistemu radijacione zaštite", <i>Zbornik izvoda radova III simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 1998 (s. 46)	M64
136.	M. Kocić, S. Djorić-Veljković i D. Stojiljković, "Elementi slabljenja talasa u optičkim vlaknima", <i>Zbornik izvoda radova III simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 1998 (s. 48)	M64
137.	S. Djorić-Veljković , M. Kocić, D. Stojiljković i D. Vučić, "Neka pitanja razvoja tehnologije optičkih vlakana i optičkih kablova", <i>Zbornik izvoda radova III simpozijuma "Savremene tehnologije i privredni razvoj"</i> , Leskovac, oktobar 1998 (s. 47)	M64